

**產品:** 麵粉玉米餅

**目標:** 測量玉米餅的拉伸性、斷裂點和硬度

**動作模式:** 爆破測試

**測試模式:**

速度	測試模式	啟點	目標	延遲
1.7 mm/s	距離(壓)	20 gf	30 mm	0 sec

**配件:**

麵皮穿刺測試組、1cm<sup>2</sup> 圓柱體探頭、測試台

**樣品準備:**

冷卻 30 分鐘後，將玉米餅裝入雙層袋中，並在室溫下保存，直到進一步測試。玉米餅通常在煎烤後的第 1 天、第 3 天和第 7 天進行測試。通常，每個變數每天至少進行 10 次重複測試。

**計算項目:**

☑最大正力

☑至最大正力距離

**結果:**

記錄最大峰值力以及距離，並計算平均值和標準差。

**備註:**

- 本方法源自於一系列使用質構分析儀測試常見烘焙產品質構的程序。這些程序由美國烘焙協會 (AIB) 位於堪薩斯州曼哈頓的實驗烘焙實驗室開發並投入使用。
- AIB 研究人員的理念是發展極為靈活的質構測試方案。烘焙產品的種類和形狀多種多樣，因此，有意義的質構比較必須考慮到不同的產品幾何形狀。這些測試程序通常透過將產品尺寸縮小到公分母來處理幾何形狀的差異。
- 通常，大多數此類測試的目標是測量烘焙產品的硬度和保質期。由於這些方案主要涉及樣品處理，因此如果測試目標不同（例如彈性、黏結性、回彈性等），可以且應該對其進行略微修改。
- 這些方案只是開發適合您自己產品的測試方法的起點。研究人員應該能夠輕鬆地修改樣品處理方案、測試速度和距離，以適應任何特定目的。